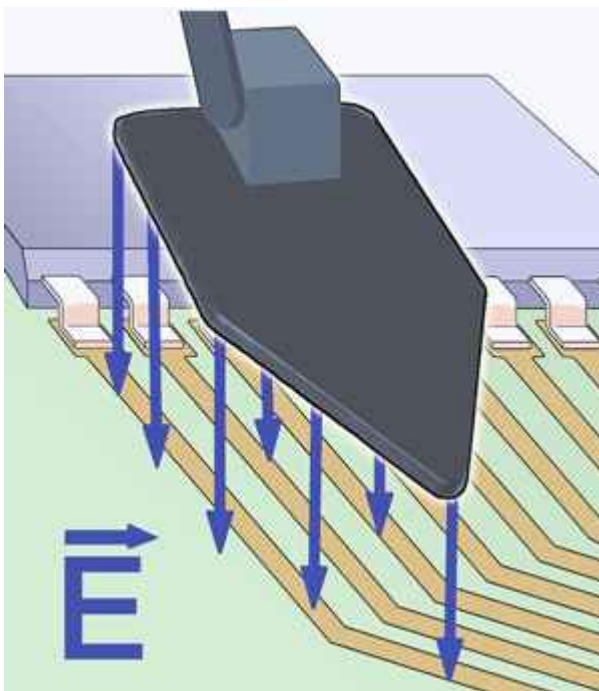


Short description

该场源的面积较大，能够大范围地向机箱表面及内部区域、连接件、带导体结构的模块以及集成电路（如总线系统，液晶显示器）等施加耦合干扰电场。该场源的尖端部位，可用于定位对电场敏感的小面积薄弱点（导线、晶振、上拉电阻、IC 等）。

The resolution of ES 02 is higher than the resolution of ES 01 field source.



ES 02

电场源探头

Application ES 02

